

1 Выводы

В данной лабораторной работе мы познакомились технологией растровой электронной микроскопии, получили изображения различных образцов в двух различных режимах работы микроскопа (детектирование вторичных и упругоотраженных электронов), применили на практике режим топографического и Z-контраста, исследовали химический состав образца с помощью рентгеновского микроанализа и столкнулись с последствиями накопления заряда в диэлектрике.